ビームモニタ

ー ビーム・インスツルメンテーション ー

1. はじめに

1984年以来今回で28回目となるOHO高エネ ルギー加速器セミナーのシリーズにおいては、ビ ームモニタについてのテキストがいくつか存在 するが、中でも OHO'09 の外山毅氏によるテキス トは秀逸であり、陽子シンクロトロン等に用いら れるビームモニタ、ビームフィードバック、ビー ム不安定性に関する基本的かつ詳細な考察が網 羅されており、基礎的な知識を学ぶには十分なも のである。一般的な知識を学ぼうとする諸氏には ぜひ一読をお勧めする。一般的なビーム・インス ツルメンテーションに関する知識を学ぶには上 記テキストで十分と思われるので、本稿では同じ ような解説を繰り返すことはせず、主に今後の陽 子シンクロトロンや次世代の放射光リングある いは SuperKEKB のような衝突型電子陽電子蓄 積リングにおいて重要となる可能性を秘めたビ ーム・インスツルメンテーションについて解説す ることにする。

ビームモニタリングで最も難しいのはシンク ロトロンや蓄積リング等、リング型加速器中をほ ぼ光速で周回している荷電粒子ビームの断面形 状(ビーム・プロファイル)を、ビームに影響を 与えることなく如何にして精度良く観測するか という問題である。ビームプロファイル・モニタ は加速器の性能向上にとって重要なビーム不安 定性などに関する詳細な情報を得る上で極めて 重要なものである。これまでいくつかの方法が実 用化され多くのリングで稼動しているが、近年大 きな可能性を秘めたブレークスルーがあったの で、本稿では二種のビームプロファイル・モニタ について解説する。更にマルチバンチで運転され る大強度のシンクロトロンや蓄積リングで、加速 器の性能を制限する深刻な横方向ビーム不安定 性を抑制するためのバンチ毎ビームフィードバ

ック・システムを統一的に記述する、z 変換を用 いた定式化について解説する。

2. ガスシート・ビームプロファイルモニタ

加速器中を周回しているビームの断面形状を 観測するには、ビームを横切るようにタングステ ン等のワイヤを挿入して、ビームが衝突すること でワイヤに流れる2次電子放出電流を検出するあ るいは発生する2次粒子をシンチレーション・カ ウンタ等で検出し、ビーム断面を横切ってワイヤ をスイープすることでビームの断面形状を観測 するワイヤ・モニタがよく知られており広く用い られている。しかしながら直接加速器中のビーム に物質を挿入する方法では、衝突によるビームの エネルギー損失及び角度分散のために円形加速 器では極く短時間でビームが失われてしまうた め加速中のビームの動的振る舞いを観測する場 合には不都合であり、このようなビームモニタを 破壊型ビームモニタ (destructive beam monitor) と呼ぶ。

破壊型ビームモニタに対して非破壊型ビーム モニタ(nondestructive beam monitor)として は、加速器中の残留ガスをビームによりイオン化 して発生するイオンの密度分布を観測すること でビーム・プロファイルを観測する残留ガス・ビ ームプロファイル・モニタや、加速器中にガスジ ェットを噴射してビームと衝突させ、発生するイ オンを増量して信号強度を増強するガスジェッ ト・ビームプロファイル・モニタがある。

以上のような、ガスのイオン化を利用したビー ムプロファイル・モニタの種々の欠点を克服し、 ビームバンチ毎にビーム・プロファイルを観測す ることを可能にしたものとして、画期的なガスシ ート・ビームプロファイル・モニタが KEK の橋 本義徳氏によって開発された[1,2]。酸素ガスを薄 いシート状に成型して加速器中のビーム軌道を 横切るように飛ばすことでビームと衝突させる。 衝突によりイオン化されたイオンを静電場にて MCP (マルチチャンネルプレート)に導いて増幅 し、その後方に設置される蛍光板上にイオンの密 度分布像を作るものである。原型は放射線医学研 究所の重イオンシンクロトロンにて微弱な重イ オンビームのプロファイルを観測する目的で開 発されたもので、高感度化のために蛍光板上の発 光像をイメージ・インテンシファイアで更に増幅 した後 CCD カメラで記録することで、二次元の ビームプロファイル像を得るものである。

加速器中の高度な真空(~10⁻⁹ Pa)に影響を 与えることなく、パルス的に薄いガスシートを発 生してビーム軌道を横切って飛ばすという、高度 な技術を実現した開発者の執念と力量には脱帽 するばかりである。ガスシート発生部の概略を図 2-1 に示す。以降本節で使用している図は橋本義 徳氏提供によるものである。



図 2-1 ガスシート発生部概略

図 2-1 の装置で生成されたシート状の酸素分子線 は、ビームバンチの通過にあわせて図 2-2 に示す ようにシート面が加速器ビームの軌道に対して 45°の角度となるように、ビーム軌道を横切って 入射される(ガスシートの運動方向は紙面に垂直 方向)。

ビームがガスシートを通過することでガスを イオン化し、発生したイオンはイオン捕獲電極で 精巧に作られた平行電場によって捕獲、加速され て MCP に入射される。電荷は MCP で増幅され、 MCP の後に配置された蛍光スクリーンにビーム 断面の電荷密度分布に比例する発光イメージを 生ずる。この発光像をイメージ・インテンシファ イアで増幅し CCD カメラにて撮像記録する。蛍 光スクリーンには光量が 1/10 に減衰する減衰時 間 80ns 以下の高速応答のものを用い、CCD カメ ラのデータ収集時間を100ns/frame以下とするこ とで加速器中のビームバンチ毎のプロファイル を観測することができる。



図 2-2 ビームプロファイル検出部

最も重要な技術はいかにしてシート状の分子 線を生成するかという極めて困難な問題である。 開発者はまず使用するガスとして、不均一磁場で 分子線を収束することができるように、大きな磁 気モーメントを持つ酸素分子ガスを用いた。



図 2-3 ノズル及びスキマー概略

図 2-3 に示すように、高速パルスバルブにより 120µsの間ノズルからガスを噴射することで、パ ルス状のガスジェットを発生する。ガスジェット は精緻に設計されたノズルとスキマーを通るこ とで断熱膨張により分子温度を数 K にまで下げ られ、速度広がりが約 80 m/s 程度にまで減少し た分子速度の揃った分子線となる。分子線の軸方 向速度は 735 m/sec、速度広がりは±10%である。

分子線を数 10 cm 飛ばした後開口 10 mm×100 mm のスリットにて扁平に切り出し、周期磁場の中を通す。酸素分子は磁気モーメント μ を持つために、不均一磁場Hによりガスシートの面と垂直方向に $\mu\partial H/\partial x$ なる力を周期的に受けることで、シートの厚さ方向に収束力を受け、発散することなく暑さ 1.3mm の薄いシート状となって加速器のビーム軌道を横切りビームと衝突する。ターゲットとしてのガス密度は最大で圧力換算 1×10⁻⁴ Pa (3×10¹⁹ molecules/sr·s) ということである。図 2-4 にガスシート横方向の密度分布を示す。全幅 85mm、平坦部の幅 60mm が得られており、パルス毎の変動は約±3%である。



図 2-4 酸素ガスシートの幅方向密度 プロファイル



図 2-5 に進行方向の分布を示す。ターゲットとして使用される領域は、ピーク近傍100 µsec の範囲(長さにして 73.5mm)であり、この範囲での密度変化は 10%以下である。なお 10%のガス密度の不均一度はターゲットとしてビームサイズの測定に使用された場合、σ=20 mmのガウスビームに対して 2.5%程度の測定誤差に対応する。

厚手のボール紙を 80mm 幅に切ったような形 状のガスシートが、その形状を崩すことなく約 1m も飛翔してビームと衝突するなど、想像した だけでも実に痛快である。



図 2-6 ガスシート・モニターで観測された ${}^{12}C^{6+}$ ビームの 2 次元断面プロファイル像

以上述べたガスシート・プロファイルモニタに よるビーム測定の例として、図 2-6 に放射線医学 研究機構の重イオンシンクロトロン HIMAC で観 測された、加速器中の炭素イオン(¹²C⁶⁺)ビー ムの1つのバンチの2次元断面像を示す。6MeV/u で入射されてからトップエネルギー430MeV/u に 加速される間の adiabatic dumping による水平方 向ビームサイズの減少、更に遅いビーム取り出し 過程 (rf キック)におけるサイズの増加が見える。 電子リングにおける放射光モニタの画像と見紛 うような、実に鮮明な2次元ビーム断面像であ る。

加速器で加速されているビームの任意のバン チの2次元プロファイルを、非破壊で明瞭に観測 することが可能な本プロファイルモニタは、詳細 なビーム情報を提供してくれるものであり、加速 器の詳細な研究にとって極めて有意義であり今 後が期待される。特に究極の大強度ビーム実現に 向けて鋭意調整中の J-Parc 陽子シンクロトロン においては、困難なアパーチャー問題やビーム不 安定性の克服に極めて有用であると考えられ、今 後設置、活用されんことを願っている。

3. X線コーデッドアパーチャー・ ビームサイズモニタ

KEKB ファクトリー加速器のような衝突型蓄 積リングにおいては、加速器中の電子、陽電子ビ ームのビームバンチを安定にかつできる限り小 さな断面サイズに制御することがハイ・ルミノシ ティーを実現する上で最重要な課題である。その ためにはミクロンオーダーのビームサイズを精 度良く測定することが求められる。電子や陽電子 の蓄積リングではビームがベンディング電磁石 の磁場中を運動するときに放射する、シンクロト ロン放射(放射光)を観測することでビームサイ ズを測定することができる。しかしながら放射光 のイメージをカメラで撮像する方法では、放射光 の回折現象のために制度の良い測定は不可能で ある。現在精度の高い方法として広く用いられる 測定法は、天体の角直径の測定などにもちいられ ている干渉計にヒントを得て、KEK 放射光施設 の三橋利行氏によって開発された放射光干渉計 による方法である。放射光干渉計は放射光の可視 光成分をダブルスリット干渉計(マイケルソン干 渉計)を用いて観測される、干渉縞の濃度パター ン(フリンジパターン)からビームサイズを測定 するものであり、回折効果の影響を受けないため 概ね 10 ミクロン程度以上のビームサイズ測定に おいては精度の高い測定が可能である。

しかしながら現在 KEK で建設が進められてい る SuperKEKB のような 10 ミクロンオーダーの ビームサイズ測定は極めて困難である。このよう な小さなビームサイズ測定においては回折効果 が最も大きな誤差原因であることから、回折効果 が無視できるような短い波長のX線成分を、ピン ホールカメラや単色化した後フレネゾーン・プレ ート等で観測することが一般的である。しかしな がら、ピンホールカメラでは像が暗いため、多く のビームバンチの平均的なバンチサイズを知る ことは出来るが、単一のビームバンチの放射光イ メージからビームバンチのサイズを精度よく測 定することは不可能であり。またフレネゾーン・ プレートは放射光の平均強度が大きい場合には 熱的損傷が問題となるため測定の自由度が制限 されてしまう。

そこで KEK の J. Flanagan 氏により、微小な x 線源の観測に用いられる x 線コーデッド・アパ ーチャーマスク・カメラからヒントを得たビーム サイズモニタが開発され、コーネル大学の電子リ ングにてその有効性が実証された[3,4]。現在、更 なる精度向上の研究が進められている。コーデッ ド・アパーチャー・マスクは天体観測やレーザー 核融合などの分野で使われてきた x 線撮像法で [5,6]、例えばレーザー核融合におけるペレットの 爆縮過程の観測に以前から用いられてきた方法 であり、1-10 μm オーダーの微小な x 線源のイメ ージングに活用されている(補遺 A 参照)。

コーデッドアパーチャー・マスクとは原理的に は多数のピンホールをあけたマスクと同じもの である。ピンホールの個数をNとすると得られる イメージもN個得られる。したがって全てのイメ ージを重ね合わせることで明るいイメージを得 ることができ、精度の高い測定が可能となる。ま た、マスク上のピンホールを適当な法則性に基づ いて配列した URA マスク (Uniformly Redundant Arrays mask)を用いることで、光源 (ビー ム断面)の形状を再現することができる。 そこで、まず図 3-1 に示すように一つの 1 次元 ピンホール即ちシングル・スリットによって出来 る光源のイメージを考えてみる。スリットの回折 効果は無視できるものとし、光源からスリットを あけたマスクまでの距離を L_1 、マスクからスクリ ーンまでの距離を L_2 とする。



図 3-1 1次元ピンホールカメラ (スリットカメラ)の原理図

マスク上の座標をx'とし、光源面の点 ξ から出 た光線がx'を通ってスクリーンに達する点の座 標をxとすると

$$x' = \frac{L_2 / L_1}{M} \xi + \frac{x}{M}$$
(3.1)

が成立する。ここで $M = 1 + L_2 / L_1$ である。従 って光源の強度密度分布を $\rho(\xi)$ とすると、スク リーン上のイメージの明るさの分布は

$$p(x) = \int \rho(\xi) a(x') d\xi \qquad (3.2)$$

となる。ここでa(x')は、(3.1)式で決まるx'がス リットの開口部にあるときは1、スリット開口部 から外れているときは0(またはマスクによる吸 収に対応する1以下)の値をとるものとする。こ こでは0として考える。 $\rho(x)$ をガウス分布関数

$$\rho(x) = \rho_0 e^{-x^2/2\sigma^2}$$
(3.3)

とするとスクリーン上のイメージの明るさ分布 は図 3・2 のようになる。ここで $\sigma = 2 \mu m$ 、スリ ット幅は $d = 10 \mu m$ 、M = 10とした。即ちスリ ット幅がビーム広がりより大きい($d/2 > \sigma$)場 合は、光源像が広がってしまい精度よく再現する ことはできない。精度を上げるにはスリット幅を 光源幅より小さくする必要があるが、イメージが 暗くなってしまうので精度を上げることが困難 になってしまう。このようにシングル・スリット (即ち一つのピンホール)だけでは小さな光源を 精度よく観測することは困難である。



(ガウス分布光源)

そこで補遺Aにあるような、多数のピンホール から成るURAコーデッド・アパーチャー・マスク を用いた x線URAアパーチャー・カメラの原理を 1次元像に適用した、x線ビームサイズ・モニタ が開発された[3]。通常の x線URAアパーチャー・ カメラにおける光源像の再生アルゴリズムでは、 x線の波長は短いので回折効果は無視できるもの としているが、放射光による10µm オーダー以下 の光源(ビーム断面)の測定には注意が必要であ る。

放射光の波長 λ と光子エネルギー ε の関係は λ (nm)=1.24/ ε (keV)

で与えられる。 $\lambda = 0.062 \text{ nm} (\varepsilon = 20 \text{ keV})$ 、光 源からマスクまでの距離を $L_1 = 5 \text{ m}$ 、スリット幅 を $d = 10 \mu \text{m}$ とすると、スリットのエッジにおけ る回折効果による広がりは

$\Delta \theta \approx \pi / kd = 3.1 \,\mu rad$

となるので、光源位置に換算した広がりは $\Delta \xi \approx L_1 \Delta \theta = 16 \ \mu m$

となるため、光源サイズが10 μm オーダー以下の 場合は回折効果を考慮した解析が必要であり、通 常の URA アパーチャー・カメラのように光源象 を精度よく再生することは困難である。

そこでJ. Flanagan 氏は Fresnel-Kirhhoffの回 折積分を実行することでスリットの回折効果を 考慮に入れた放射光観測に対する解析方法を開 発した。よく知られているように電子等が放射す るシンクロトン放射は、σ 偏光およびπ 偏光の二 つの偏光成分から成り、ベクトルポテンシャルの フーリエ成分は

で与えられる。ここで $\eta = (\omega/2\omega_c)\{1 + (\gamma\psi)^2\}^{3/2}$ 、 ψ は観測方向と軌道面の成す角度、 ω はx線の周 波数である。マスク材質の透過率を考慮に入れ て、マスク面上で回折積分を実行することで、ス クリーン上で観測される $A_{\sigma,\pi}(y)$ を得る。

$$A_{\sigma,\pi}(\omega, y) = \frac{l}{2\lambda} \int_{\text{mask}} A_{\sigma,\pi}(\omega, y_m) t(y_m) \\ \times \frac{e^{i2\pi(r_1 + r_2)/\lambda}}{r_1 r_2} (\cos\theta_1 + \cos\theta_2) dy_m$$

(3.5)

ここで $A_{\sigma,\pi}(\omega, y_m)$ はマスク面上の $A_{\sigma,\pi}$ であり、発光点(着目している電子)のy座標を y_s として、(3.5)式において ψ を

 $\psi(y_m) = (y_m - y_s)/L_1$ (3.6) と置き換えたものである。 y、 y_m はそれぞれス クリーン、マスク上の y座標(垂直方向)、 (r_1, θ_1) は光源からマスク上の点 y_m までの距離および角 度、 (r_2, θ_2) はマスクからスクリーン上の点 yま での距離および角度、 $t(y_m)$ はマスク材質の複素 透過率である。スクリーンに達する単位面積当た りの放射光エネルギー

$$\frac{dW}{dxdy} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 c} \int_0^\infty \{ |A_\sigma(\omega, y)|^2 + |A_\pi(\omega, y)|^2 \} d\omega$$

(3.7) より、スクリーン上の像の明るさ分布を得る。コ ーデッドアパーチャー・マスクには最もよく用い られるスリット開口率 50%の1次元 URA マスク を用いることにした。以降本節で使用している図 は J. Flanagan 氏提供によるものである。



図 3-3 実証実験で用いた URA マスクパターン

図 3-3 に URA マスクのスリット配列を示す。 この URA マスクを用いて測定されたコーネル大 学電子蓄積リングの放射光イメージを図 3-4 に示 す[3]。カラー原図のため判然としないが、赤線は 測定値、青線はビームの垂直方向(y 方向)サイ ズ(光源サイズ)を $\sigma_y = 10 \ \mu m$ として(3.4)-(3.7) 式から予測される計算値であり、データがよく再 現されている。



図 3-4 マスク上のイメージの明るさ分布 (at CesrTA)

図 3-5 は KEKB の発展型後継蓄積リングとして KEK で建設が進んでいる SuperKEKB における コーデッドマスクイメージング・ビームサイズモ ニタ (σ_y モニタ) で用いられる予定の URA マス クパターン、図 3-6 は予想される x 線イメージで ある。ビームサイズによりスリット像がスムージ ングされて変化していることが分かる。マルチセ グメント x 線検出器から成るスクリーン上に得ら れるこのような像を、(3.4)-(3.7)式を用いてフィッ ティングすることでビームサイズを観測する。







図 3-6 SuperKEKB における URA マスク による x 線イメージの予想

なお、測定分解能は x 線検出器の1セグメント 当たりの光子数に依存する。図 3-7 に 2 種類の検 出器を用いたときの統計的分解能の予想を示す。 原図がカラーのため判然としないが、広がりの大 きい方がコーネル大学の蓄積リングで使用した x 線検出器、広がりの小さい方が改良予定の高感度 検出器を用いたときに期待される測定誤差であ る。



図 3-7 期待されるビームサイズの 測定誤差 (SuperKEKB/LER)

これより $10 \,\mu m$ 程度のビームサイズの観測に 対して $\pm 1 - 2 \,\mu m$ 程度の誤差が予想され、現在更 なる精度向上に努めているところである。

以上述べた開発中の URA コーデッドアパーチ ャー・マスク法は、マスクによる回折効果が無視 できないので光源像の再現は困難であるため、ガ ウス分布ビームを仮定してスクリーン上のイメ ージをフィッティングすることでビームサイズ を求めることにしている(この場合、強いて URA マスクである必要があるのか疑問ではあるが、イ メージの明るさ即ちx線検出器の統計誤差の改善 には透過効率の高い URA マスクが有効であろ う)。本来の2次元または3次元光源像の再現を 目指した URA マスク・コーデッドアパーチャー・ カメラとは少しコンセプトが異なると思われる が、三橋利行氏による放射光干渉計と並んで、加 速器中のビーム観測にとって大きなブレークス ルーであると考えられる。

特にSuperKEKBにおいては、リング中の2500 個以上のバンチから成る電子・陽電子ビームの、 個々のバンチのサイズを精度良く測定すること ができるものと期待され、詳細なビーム不安定の 調査、研究に極めて有用なインスツルメンテーシ ョンとなることが期待される。

4. ビーム・フィードバック

4-1 伝達関数

KEKB や SuperKEKB のような大電流蓄積リ ングでは強いビーム不安定性のために、無対策で は20~30 mA程度のビームを蓄積するのが精一杯 であり、アンペアオーダーのビームを蓄積するた めにはビーム不安定性を抑制するためのビーム フィードバックが必要不可欠である。上記リング のような極めて多数のビームバンチが蓄積され る場合には、ビームによってバンチの周期とリン グ中のビームの回転周期に同期した電磁場が誘 起され(航跡場、wake field)、それによってビー ム自身が電磁力を受けてベータートロン振動が 励起され、ビームサイズが増大してルミノシティ ーが低下したり、振動振幅がビームパイプのアパ ーチャーを超えてビームが失われてしまう、横方 向マルチバンチ不安定性が深刻な問題となる。

このような横方向ビーム不安定性を抑制する ために図 4-1 に示すように、ビームバンチの横方 向ベータートロン振動をビーム位置検出器 (BPM)にて検出して増幅した後、キッカーに加 えてバンチを蹴りもどして振動を抑えるフィー ドバック装置(横方向バンチ毎ビームフィードバ ック)が用いられる。



図 4-1 ビームフィードバック概念図

このようなビームの運動を含んだフィードバック系 は、z変換を適用することにより統一的に解析すること ができる[7]。ビームの横方向運動(ベータートロン振 動)はリング一周のビーム転送行列

 $M = \begin{pmatrix} \cos \mu + \alpha \sin \mu & \beta \sin \mu \\ -\gamma \sin \mu & \cos \mu - \alpha \sin \mu \end{pmatrix}$ (4.1) によって記述される。リングの軌道上キッカーの位置 s_1 おける、n ターン目のバンチ中心の平衡軌道(閉軌 道という)からの変位及び平衡軌道に対する運動方向 の傾きを (x_n, x'_n) とすると、n+1 ターン目の (x_{n+1}, x'_{n+1}) は

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x'_{n+1} \end{pmatrix} = e^{-T_0/\tau} M \begin{pmatrix} x_n \\ x'_n \end{pmatrix}$$
(4.2)

で与えられる。ここで $\mu = 2\pi v$ はリング一周当たり

のベータートロン振動の位相進み、vはリングー 周当たりの振動数(ベータートロン・チューン) である。 T_0 はビームがリングを一周する時間、 τ は放射ダンピングやチューンの広がりによるバ ンチ中心の振動のダンピング時間である。 $\tau < 0$ の場合は $-\tau$ がビーム不安定性によるコヒーレン トなベータートロン振動の成長時間を表わして いる。従ってキッカーによるビームの蹴り角を $\Delta x'(s_1)$ とすると

$$\begin{pmatrix} x_n \\ x'_n \end{pmatrix} = e^{-T_0/\tau} M \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ x'_{n-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \Delta x'_n \end{pmatrix}$$

$$= e^{-nT_0/\tau} M^n \begin{pmatrix} x_0 \\ x'_0 \end{pmatrix} + \sum_{k=0}^n e^{-(n-k)T_0/\tau} M^{n-k} \begin{pmatrix} 0 \\ \Delta x'_k \end{pmatrix}$$
(4.3)

より、初期値を $(x_0, y_0) = (0, 0)$ として無視することで、 $\Delta x'(s_1)$ に対するビーム軌道の応答

$$x_{n} = \sum_{k=0}^{n} g_{1}(n-k)\Delta x_{k}'$$

$$x_{n}' = \sum_{k=0}^{n} g_{2}(n-k)\Delta x_{k}'$$

$$(4.4)$$

$$\begin{array}{c} \mathcal{Z} \uparrow \neq \mathcal{Q}_{0} \quad \subset \quad \subset \quad C \\ g_{1}(n-k) = e^{-(n-k)T_{0}/\tau} \beta_{1} \sin(n-k)\mu \\ g_{2}(n-k) = e^{-(n-k)T_{0}/\tau} \left\{ \cos(n-k)\mu - \alpha_{1} \sin(n-k)\mu \right\} \end{array}$$

$$(4.5)$$

である。

た。但て

$$v_n^K = -A_1 A_2 \sum_{m=1}^M h_m v_{n-m}^B + A_2 e_n \qquad (4.6)$$

で与えられる。ここで h_m は FIR フィルターのm 番目 のタップの重み、 e_n はパワーアンプへの外部入力 あるいは入力雑音電圧である。

ここで *n*₁₁、 *n*₁₂ をキッカーから BPM までのビー ム転送行列

$$N = \begin{pmatrix} n_{11} & n_{12} \\ n_{21} & n_{22} \end{pmatrix}$$

の成分として、 x_n^B は

$$x_n^B = n_{11}x_n + n_{12}x_n' \tag{4.7}$$

で与えられる。キッカーから BPM までのベータート ロン位相進みをψ12とすると

$$n_{11} = \sqrt{\frac{\beta_2}{\beta_1}} (\cos \psi_{12} + \alpha_1 \sin \psi_{12}) \\ n_{12} = \sqrt{\beta_1 \beta_2} \sin \psi_{12}$$

$$(4.8)$$

である。これよりキッカーのキック角を $\Delta x'_n = K_K v_n^K$

$$\begin{array}{l} & \downarrow \\ \downarrow \\ \Delta x'_n = K_K A_2 \end{array}$$

$$\times \{-K_B A_1 \sum_{m=1}^{M} h_m \left(n_{11} x_{n-m} + n_{12} x'_{n-m} \right) + e_n \}$$
(4.10)

となる。

 $\Delta x'_n =$

次に
$$x_n, x'_n, e_n, g_1(n), g_2(n)$$
の z 変換を
 $X(z) = \mathbb{Z}[x_n], X'(z) = \mathbb{Z}[x'_n], V(z) = \mathbb{Z}[e_n]$
 $G_1(z) = \mathbb{Z}[g_1(n)], G_2(z) = \mathbb{Z}[g_2(n)]$
として、(4.4)式、(4.10)式に対して z 変換を行うこと
で閉ループ応答

$$X(z) = G(z)V(z)$$
 (4.11)
を得る。 $G(z)$ は閉ループ伝達関数であり

$$G(z) = \frac{\frac{K}{A_1 K_B} \sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}} G_1(z)}{1 + K \sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}} \left(n_{11} G_1(z) + \frac{n_{12}}{\beta_1} G_2(z) \right) F(z)}$$

(4.12)

(4.9)

$$G_{1}(z) = \frac{ze^{-T_{0}/\tau} \sin \mu}{z^{2} - 2ze^{-T_{0}/\tau} \cos \mu + e^{-2T_{0}/\tau}} \begin{cases} (4.13) \\ G_{2}(z) = \frac{z^{2} - e^{-T_{0}/\tau} (\cos \mu + \alpha_{1} \sin \mu)z}{z^{2} - 2ze^{-T_{0}/\tau} \cos \mu + e^{-2T_{0}/\tau}} \end{cases}$$

また

$$F(z) = \sum_{m=1}^{M} h_m z^{-m}$$
(4.14)

は BPM 信号を処理する M タップ FIR デジタル フィルターの伝達関数である。 β_1 、 β_2 はそれぞ れキッカーおよび BPM 位置でのベータートロン 振動の抱絡線関数 $\beta(s)$ の値、また

$$K = A_1 A_2 K_B K_K \sqrt{\beta_1 \beta_2} \tag{4.15}$$

は規格化ループゲインである。

電子回路の応答でお馴染みのラプラス変換で 導かれる伝達関数の場合と同様、伝達関数G(z) の分母=0即ち特性方程式

$$z^{2} - 2ze^{-T_{0}/\tau} \cos \mu + e^{-2T_{0}/\tau} +K\{z^{2} \sin(\mu - \psi) + ze^{-T_{0}/\tau} \sin \psi\}F(z) = 0$$

の根
$$z_p$$
 ($p = 1, 2, \cdots$)により逆変換
 $x = \mathbb{Z}^{-1} [X(z)] = \frac{1}{2} \oint G(z) V(z) z^{n-1} dz$ (4.17)

$$x_n = \mathbf{Z}^{-1} [X(z)] \equiv \frac{1}{2\pi j} \oint_C G(z) V(z) z^{n-1} dz \quad (4.17)$$

を求めることが出来る。また

$$G_{0}(z) = K \sqrt{\frac{\beta_{1}}{\beta_{2}}} \left(n_{11}G_{1}(z) + \frac{n_{12}}{\beta_{1}}G_{2}(z) \right) F(z)$$
(4.18)

は一巡ループ伝達関数(オープンループ伝達関 数)と考えられG(z)及び $G_0(z)$ の周波数特性は $G(e^{j\omega T_0})$ 、 $G_0(e^{j\omega T_0})$ で表わされる。

簡単な例として FIR フィルターがシングル・タ $y ' (h_1 = 1, h_m = 0 (m ≥ 2))$

$$F(z) = z^{-1}$$
 (4.19)

の場合を考察してみる。このときの特性方程式は $z^{2} + \{K\sin(\mu - \psi) - 2e^{-T_{0}/\tau}\cos\mu\}z$

$$+e^{-T_0/\tau}(K\sin\psi + e^{-T_0/\tau}) = 0 \qquad (4.20)$$

なる 2 次方程式になる。ここで $\psi = \mu - \psi_{12}$ であ る。 $e_n = V_0 \delta_{n0}$ としてインパルス応答を求める と、(4.22)式の根をz+として(4.19)式より

$$x_n = V_0 \frac{K e^{-T_0/\tau} \sin \mu}{A_1 K_B} \sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}} \frac{z_+^n - z_-^n}{z_+ - z_-} \quad (4.21)$$

を得る。即ちターン数nとともに、バンチ中心の 変位が $|z_+|^n$ で変化する二つの振動モードから成 ることが分かる。運動が安定であるためには $|z_{\pm}| < 1$ でなければならない。



図 4-2 特性方程式の根(LER/KEKB)(シングル・タップ FIR フィルター)



図 4-3 ダンピング時間(LER/KEKB)(シングル・タップ FIR フィルター)

また振動のダンピング時間は

$$\tau_{\pm} = -T_0 / \ln |z_{\pm}|$$
 (4.22)
で与えられる $(|z_{\pm}^n| = z_0 e^{-nT_0/\tau_{\pm}})_{\circ}$ ここで
 $\sin \psi = -1$ (4.23)

となるように BPM とキッカーを配置しているも のとすると、 $T_0 << \tau$ では、安定条件を満たす規 格化フィードバックゲインの範囲は

$$0 < K < 2$$
 (4.24)

例として KEKB を考えると、 $T_0 = 10 \,\mu \text{sec}$ 、 $\tau \approx 20 \,\text{msec}$ より

$$T_0 / \tau \approx 5 \times 10^{-4} << 1$$

であり、安定領域は(4.25)式で与えられる。 図 4-2、図 4-3 に示す $|z_{\pm}|$ 、 τ_{\pm} の*K*依存性から分 かるように、特性方程式が重根 $(z_{+} = z_{-})$ を持つ ときダンピング時間が最小になることが分かる。

となる。

最小ダンピング時間を与えるゲインを K_0 とす ると、フィードバックゲインKが K_0 より大きく ても小さくても τ_{\pm} は大きくなる。更に τ_{\pm} のゲイ ン依存性はチューンによって大きく影響され、特 にチューンが整数または半整数に近い場合には 急激に変化するので注意が必要である。

オープンループ及びクローズドループ伝達関数の周波数特性 $|G_0(e^{j\omega T_0})|$ 、 $|G(e^{j\omega T_0})|$ を図 4-4 に

示す。サンプリング定理により周波数特性は $f_0 = 1/T_0$ 毎に周期的となっている。特性はチュ ーン(の端数)に依存し、チューンが半整数に近 いとチューンに敏感になる。(b)図では z_+ 、 z_- の 二つのモードに対応するピークがv = 0.42, 0.57にあることが分かる。クローズドループでは v = 0.42のレスポンスは約 30 dB、v = 0.57のレ スポンスは約 40 dB抑制されていることが見てと れる。



図 4-4 オープンループ及びクローズドループ伝達関数の周波数特性

4-2 KEKB のビームフィードバック

以上のようにフィルターがシングルタップの 場合は特性方程式が2次式となるので、解析的に 解くことが出来るが、2タップ以上のマルチタッ プフィルターの場合は特性方程式が3次以上とな るので解析的な解法は困難であり、数値計算に頼 ることになる。

実際の加速器では閉軌道歪 (COD) があるため、 シングルタップ FIR フィルターでは BPM 信号に 大きなオフセット成分を生じ電子回路のダイナ ミックレンジを大きく損ねてしまうので実用に はならない。このようなオフセット成分を除去す るために、IIR フィルターまたはマルチタップ FIR によるハイパスフィルター (HPF) またはバ ンドパスフィルター (BPF) が用いられる。

例として KEKB で採用されていた 2 タップ・ FIR フィルター $h_1 = 1, h_2 = -1, h_m = 0 \ (m \ge 3)$ の 場合を考えると

$$F(z) = z^{-1} - z^{-2} \tag{4.25}$$

より特性方程式は3次となる。この場合の特性方 程式の根 $|z_p|$ (p = 1, 2, 3)およびダンピング時間 $|\tau_p|$ の計算例を図 4-5、4-6 に示す。図から分か るようにフィードバック・ゲインの安定領域は 0 < K < 1となり、シングル・タップの場合の 1/2 に減少している。通常のフィードバックと同様、 時間遅れ要素が増加するとループの安定領域が 狭まるので、タップ数が多いときには注意が必要 である。ノイズ成分を抑制してフィードバック信 号のS/N比を向上するにはタップ数を多くするこ

とが望まれるが、ループの安定性を広く確保する 観点からはタップ数は少ない方が望ましい。タッ プ数が多い場合にはダンピング時間及びフィー ドバック信号のS/Nについて、フィルター関数(タ ップの重み)の最適設計が必要である。



図 4-5 特性方程式の根(2タップ FIR フィルター)



図 4-6 ダンピング時間(2タップ FIR フィルター)

フィードバック

大強度陽子シンクロトロン J-Parc 50GeV リン グでは今後ビーム強度が上がるに伴い、強いビー ム不安定性が予想されるためバンチ毎ビームフ ィードバック・システムが設置されている。フィ ードバック信号の S/N を改善するために、BPM 信号からベータートロン振動を選択し、キッカー でビームをキックするための最適なベータート ロン位相差を作るために、16 タップの FIR バン ドパスフィルター (BPF) が用いられている。以 下で栗本佳典氏による伝達関数の安定性解析の 概略を紹介する[8]。

 $\frac{dB}{-10}$ -15 -25 -30 -25 -30 -25 -30 -25 -30 -25 -30 -30 -40 -10

(b)位相特性



BPM とキッカーはほとんど同じ場所(ベータ ートロン位相で~14°の差)に設置されていて、 $\beta_1 = \beta_2 = 15 \text{ m}$ 、チューン(の端数)は $\nu = 0.4$ 、 必要なベータートロン位相差は -104° である。そ こで $\nu = 0.4$ に共振し -104° の位相差を持つ BPF を 16 タップ・FIR フィルターで実現したときの フィルターの周波数特性及び位相特性を図 4-7 に 示す。

16 タップ FIR フィルターを用いたときのフィ ードバックループの特性方程式は 17 次となり、 17 個の根が求まる。 $\nu = 0.4$ として規格化ループ ゲイン $K \ge 0$ から1まで変えたときの根の軌跡を 図 4-8 (a) に示す (図では 16 個の根しか見えない が理由は不明である)。



(a) 特性方程式(16次)の根軌跡
 (円は|z|=1を示す)(K=0 to 1)



図 4-8 J-Parc 50GeV リングにおけるビーム フィードバックの例 (栗本佳典氏提供)

図で分かるように破線で囲った複素共役の関 係にある2つの根が安定性を支配しており、ダン ピング時間を決定している。図4-8(b)に示すよ うに安定なゲインの領域は0<K<0.24であり、 最小ダンピング時間はK=0.11のときビームの 周回数にしてほぼ130ターン程度であることが分 かる。即ち成長時間が130ターン以上のビーム不 安定性を抑制することができる。タップ数が大き く時間遅れの大きい要素を含むので、図4-6の2 タップフィルターに比べて更に安定領域が狭く、 最小ダンピング時間が長くなっている。

4-4 KEKB のビームフィードバック(マルチ

タップ FIR フィルター)

KEKB のビームフィードバックのフィルター はコミッショニング開始から長い間2タップ FIR フィルターを用いていたが、シャットダウンの2 ~3年ほど前から、SLAC と共同で新たに開発し たユニバーサルなマルチタップ・デジタルフィル ターに変更された。



図 4-8 16 タップ FIR フィルターを用いた ビームフィードバックによる、KEKB リング のビームの振動(飛山真理氏提供)

図 4-8 に 16 タップ FIR フィルターを用いたと きの KEKB リングにおけるマルチバンチ・ビー ム不安定性の成長とダンピングの様子を示す。数 msec かけて成長してきた不安定がビームフィー ドバック・ループを on にすることで 0.7~0.8msec (ターン数にして 70~80 ターン) でダンプされる 様子が見える。SuperKEKB などで、成長時間が 10 ターン程度の強いビーム不安定性がある場合 にはタップ数を減らす必要が生ずるかもしれな い。残念ながらフィルター関数の詳細を把握して いないため、これ以上の解説はできない。

4-5 軌道ノイズ

コライダー・リングにおいてはビームフィード バック信号のノイズによってビームが振動し、ル ミノシティーが減少してしまうという問題があ る。シミュレーションによれば振動振幅がビーム サイズの1% 程度以上あると顕著なルミノシティ 一低下が起きると予想されていて、フィードバッ クシステムに対して厳しい S/N が要求される。そ のため、雑音を抑えるためにフィードバックゲイ ンを十分に上げられず、必要なダンピング時間を 実現できなくなる可能性を生ずる問題がある。

 $e_n をパワーアンプへの入力ノイズとすると、$ $<math>e_n はフィルター回路の出力ノイズ<math>e_{n1}$ およびパワ ーアンプ自身の入力換算ノイズ e_{n2} の和である。

 $V_{n1}(z) = \mathbb{Z}[e_{n1}(n)], V_{n2}(z) = \mathbb{Z}[e_{n2}(n)]$ (4.26)
として(4.11)式における $V(z) = \mathbb{Z}[e_n]$ は

 $V(z) = A_2 V_{n1}(z) + V_{n2}(z)$ (4.27) となる。ノイズ $e_{n1} \ge e_{n2}$ は異なるタップの間では 自己相関がないのもとすると、 $e_{n-k}e_{n-k'}$ の期待値 は

 $\langle e_{n-k}e_{n-k'} \rangle = (A_2^2 V_1^2 + V_2^2)\delta_{kk'}$ (4.28) となる。ここで $V_1^2 = \langle e_{n1}^2 \rangle$ 、 $V_2^2 = \langle e_{n2}^2 \rangle$ である。 これよりフィードバック系のノイズにより励起 されるビームの軌道ノイズは次式で与えられる。

$$\langle x_n^2 \rangle = \sum_{k=0}^n \sum_{k'=0}^n g(k)g(k') \langle e_{n-k}e_{n-k'} \rangle$$

= $(A_2V_1^2 + V_2^2) \sum_{k=0}^n \{\sum_p [z^{k-1}(z-z_p)G(z)]_{z=z_p}\}^2$

(4.29)

(4.29)式より、十分時間を経た後(n→∞)の軌

道ノイズの期待値は

となる。ここで

$$\langle x_n^2 \rangle = \{ (A_2 V_1)^2 + V_2^2 \} \left(\frac{\beta_1}{E/e} \right)^2 \frac{2R_s}{Z_0}$$

 $\times e^{-2T_0/\tau} \sin^2 \mu \sum_{p=1}^3 \sum_{q=1}^3 \frac{K_p K_q}{1 - z_p z_q}$

(4.30)

$$K_p = \frac{z_p}{(z_p - z_q)(z_p - z_{q'})} \quad (q \neq p, q' \neq p, q \neq q')$$

(4.31) であり、 z_p (p = 1, 2, 3) は特性方程式の根である。



(a)
$$v = 0.51$$



(b) v = 0.57



KEKB の2タップ FIR フィルターを用いたビ ームフィードバック・システムにおいて、実測し たノイズから(4.30)式により計算された軌道ノイ ズを図 4-9 に示す。破線はキッカー入力(パワー アンプ出力)におけるノイズ電圧のrms期待値、 実線は軌道揺らぎ(ノイズ)のrms期待値である。 チューンが半整数に近くなるとノイズに敏感に なり、軌道揺らぎが大きくなる((a)図)。ビーム 軌道面と垂直方向(y 方向)のビームサイズは、 キッカーの位置で $\sigma_v = 100 \sim 150 \,\mu\text{m}$ であるの で、ノイズによる軌道揺らぎは1~2μm 程度以下 に抑えることが望まれるが、図 4-9 からはそこま でノイズを抑えるのは難しそうに思われ、ノイズ の詳細な測定と解析が必要と考えられる。そのた め KEKB におけるフィードバックゲインKは 0.1以下の非常に小さな値(0.02~0.05程度か?) でオペレーションされていた。図のようにゲイン とともにノイズが大きくなるのは、BPM からパ ワーアンプ入力までの間に存在するノイズが支 配的であり、パワーアンプ自身のノイズは問題な いことを示している。SuperKEKB では KEKB より更に一桁程度ノイズを抑制する必要がある と考えられ、BPM 信号および信号処理部の高 S/N 化が望まれる。

5. あとがき

加速器の勉強をする上で、OHO 加速器スクー ルのテキストには大変お世話になってきた。もは や年寄りの出る幕ではないが、今回が最後のつも りで感謝の気持ちを込めて講師を引き受けるこ とにした。筆者が 34 年前に KEK 12GeV PS のビ ームモニタの仕事に従事して以来、高エネルギー 加速器の進展とともにビームモニタのコンセプ トと技術は大きく進展してきた。特に KEKB の ようなコライダー・リングでは、各種のビームハ ンドリング機器を種々のビームモニタ情報でリ アルタイム・フィードバック制御する技術がハ イ・ルミノシティーを追求する上で必須技術とな った。それにはモニタ装置の高精度化はもとよ り、最適伝達関数の設計/構築が高精度ビーム制 御の必須条件である。伝達関数を考える上で参考 となる一例として、4節でビームフィードバック 系の z 変換による定式化と解析を詳細に紹介し た。J-Parc、SuperKEKB、ERL/KEK と最先端 の加速器がその性能を最高度に発揮するには、ビ ーム・インスツルメンテーションが提供するビー ム情報が不可欠であり、フィードバックのための デジタル制御技術が重要となる。諸兄の今後の活 躍と更なる発展を心から期待したい。また、本ス クール前校長の木村嘉孝先生、鎌田進氏並びに現 校長の古屋貴章氏に感謝したい。

参考文献

- Y. Hashimoto et al., Nucl. Instr. And Meth. A527(2004)289.
- [2] 橋本義徳 他, 日本加速器学会誌, 1(2004)216.
- [3] J. W. Flanagan et al., Proc. IPAC10, Kyoto, p.966 (2010).
- [4] J. W. Flanagan et al., 第7回日本加速器学会 年会プロシーディングス, Himeji, p.618 (2010)
- [5] E. E. Fenimore and T. M. Canon, Appl. Opt. 17 (1982) 337
- [6] "URA コーデッド・アパーチャ・カメラ",山
 田淳他,テレビジョン学会技術報告7(5)
 ED708, 1983-06, p.65-70.
- [7]V. M. Zhabitsky, Proc. of PAC1993, p.2543.
- [8] 栗本佳典 私信 2010-7-12.

補遺A:コーデッドアパーチャ・ イメージング

アパーチャマスク面上の座標を(x', y')とし、 (x', y')が開口部に対応するときは1、それ以外は 0となるアパーチャ関数をa(x', y')、スクリーン 面上で観測される像の強度をp(x,y)、光源の強 度分布を $\rho(\xi, \eta)$ とすると、p(x, y)は

 $p(x,y) = \iint \rho(\xi,\eta) a(\frac{L_2/L_1}{M}\xi + \frac{x}{M}, \frac{L_2/L_1}{M}\eta + \frac{y}{M})d\xi d\eta$ (A1)
で与えられる。ここで $M = (L_1 + L_2)/L_1$ である。

マスク面及び光源面をセグメントに分けて、それ ぞれのセグメントの番号を(i, j)、(n, m)とする と、(A1)式は

$$P(n,m) = \sum_{i} \sum_{j} S(i,j) A(n,m;i,j)$$
(A2)

と近似できる。ここで

$$\sum_{n,m} A(n,m;i,j)G(n,m;k,\ell) = \delta_{ik}\delta_{j\ell} \quad (A3)$$

となる行列 $G(n,m;k,\ell)$ が存在すれば、光源の強 度分布はスクリーン上の像P(n,m)から

$$S(k,\ell) = \sum_{n,m} P(n,m)G(n,m;k,\ell)$$
(A4)

で求めることが出来る。このように光源分布を再 現することのできる(即ち*G*が存在する)行列*A* で表わされるマルチピンホール・マスクを URA マスクという。

参考までに大阪大学、レーザー核融合研究所で 開発された x 線 URA コーデッドアパーチャー・ カメラによる、0.5mmの x 線源の画像と URA マ スクを図 A-1、A-2 に示す[6]。ピンホールカメラ に比べて圧倒的な光源像再現性を示している。



(a)
 (b)
 図 A-1 (a) x 線 URA パーチャー・カメラ
 のデューデッド・イメージ、(b) x 線ピンホール・
 カメラのイメージ (文献[6]より転載)



図 A-2 x線 URA アパーチャー・マスク (文献[6]より転載)

補遺 B: z 変換によるビーム・フィード バック系の定式化

z 変換とはラプラス変換を離散的信号に拡張したものであり、サンプリングされたデジタル信号の処理系の応答を記述するのに適した変換である。周期Tでサンプルされたn番目のデータをf(nT)としてf(nT)のz変換F(z)を

$$F(z) \equiv \mathcal{Z}[f(nT)] = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) z^{-k} \quad (B1)$$

で定義する。時間遅れ kT に対しては

$$\mathcal{Z}[f((n-k)T] = F(z)z^{-k}$$
(B2)

となり、 z^{-1} が時間遅れTを表す。また $f_1(nT)$ と $f_2(nT)$ との畳み込みのz変換は

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{n} f_1(kT) f_2((n-k)T) z^{-n} = F_1(z) F_2(z)$$
(B3)

となり、各々のz変換の積となる。更に逆変換は

$$f(nT) = \mathbf{Z}^{-1}[F(z)] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C F(z) z^{n-1} dz$$

で与えられ、積分路CはF(z)の全てのポールを 囲む閉曲線である。またF(z)の周波数特性は $F(e^{j\omega T})$ で与えられる。サンプリング定理により 周波数特性は $\omega_0 = 2\pi/T$ を周期とする周期構造 を有する。

 $x_n, x'_n, e_n, g_1(n), g_2(n) の z 変換を$

$$X(z) = \mathcal{Z}[x_n], \quad X'(z) = \mathcal{Z}[x'_n], \quad V(z) = \mathcal{Z}[e_n]$$

$$G_1(z) = \mathcal{Z}[g_1(n)], \quad G_2(z) = \mathcal{Z}[g_2(n)]$$
(B5)

$$E \neq \mathcal{Z} \geq G_{1}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} e^{-nT_{0}/\tau} \beta_{1} \sin(n\mu)$$
$$= \frac{z e^{-T_{0}/\tau} \sin \mu}{z^{2} - 2z e^{-T_{0}/\tau} \cos \mu + e^{-2T_{0}/\tau}}$$
(B6)

$$G_{2}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} e^{-nT_{0}/\tau} \{\cos(n\mu) - \alpha_{1}\sin(n\mu)\}$$
$$= \frac{z^{2} - e^{-T_{0}/\tau}(\cos\mu + \alpha_{1}\sin\mu)z}{z^{2} - 2ze^{-T_{0}/\tau}\cos\mu + e^{-2T_{0}/\tau}}$$
(B7)

$$X(z) = G_{1}(z)\Delta X'(z), \quad X'(z) = G_{2}(z)\Delta X'(z)$$

$$\Delta X'(z) = -\frac{K}{\sqrt{\beta_{1}\beta_{2}}} \{n_{11}X(z) + n_{12}X'(z)\}F(z) + \frac{K}{A_{1}K_{BPM}\sqrt{\beta_{1}\beta_{2}}}V(z)$$

$$F(z) = \sum_{m=1}^{M} h_{m}z^{-m}$$

$$X(z) = G(z)V(z)$$
(B9)

ここで

(B4)

$$G(z) = \frac{\frac{K}{A_{1}K_{B}}\sqrt{\frac{\beta_{1}}{\beta_{2}}}G_{1}(z)}{1 + K\sqrt{\frac{\beta_{1}}{\beta_{2}}}\left(n_{11}G_{1}(z) + \frac{n_{12}}{\beta_{1}}G_{2}(z)\right)F(z)}$$
(Dec)

(B10) は閉ループ伝達関数、F(z)はMタップ FIR フィ

(B8)

ルターの伝達関数、

$$K = A_1 A_2 K_B K_K \sqrt{\beta_1 \beta_2} \tag{B11}$$

である。更に(B10)式を有理化して
$$G(z) = \frac{K}{A_1 K_B} \sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}} \frac{z^M e^{-T_0/\tau} \sin \mu}{D(z)} \quad (B12)$$

を得る。ここで

$$D(z) = z^{M+1} - 2z^M e^{-T_0/\tau} \cos \mu + z^{M-1} e^{-2T_0/\tau}$$

 $+ K\{z\sin(\mu - \psi) + e^{-T_0/\tau} \sin \psi\} z^M F(z)$
(B13)

である。ラプラス変換の場合と同様、伝達関数 *G(z)*の分母=0即ち

$$D(z) = 0 \tag{B14}$$

を特性方程式という。特性方程式はM +1次となり、その根 z_p (p = 1, 2, ···, M +1)はG(z)のポール

であり、 z_p により逆変換(B4)を求めることが出来る。例として $e_n = V_0 \delta_{n0}$ としてインパルス応答を求めてみると

$$V(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e_n z^{-n} = V_0$$
 (B15)

よりxnは

$$x_{n} = \frac{1}{2\pi j} \oint_{C} G(z) V(z) z^{n-1} dz$$
$$= V_{0} \frac{K}{A_{1} K_{B}} \sqrt{\frac{\beta_{1}}{\beta_{2}}} e^{-T_{0}/\tau} \sin \mu \sum_{p=1}^{M+1} R_{p} z_{p}^{M-1} z_{p}^{n}$$
(D10)

(B16)

となる。ここで
$$R_p$$
は $1/D(z)の留数$
 $R_p = \left[\frac{z - z_p}{D(z)}\right]_{z=z_p}$ (B17)

である。したがって十分時間が経った後 $(n \rightarrow \infty)$ x_n が有限であるためには

$$|z_p| < 1$$
 $(p = 1, 2, \dots, M + 1)$ (B18)

でなければならない (安定条件)。

(B10)において

とおくと

$$G_0(z) = K \sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}} \left(n_{11}G_1(z) + \frac{n_{12}}{\beta_1}G_2(z) \right) F(z)$$
$$= K \frac{z^2 \sin(\mu - \psi) + z e^{-T_0/\tau} \sin\psi}{z^2 - 2z e^{-T_0/\tau} \cos\mu + e^{-2T_0/\tau}} F(z)$$

(B19)

$$G(z) = \frac{K}{A_1 K_B} \sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}} \frac{G_1(z)}{1 + G_0(z)}$$
(B20)

と書け、 $G_0(z)$ はオープンループ伝達関数と解釈できる。

ここで筆者がまだ解けない問題が残っている。 フィルターF(z)に与えるべき最適位相はどのように考えたら良いのであろうか。 (B19)式を見る とF(z)はオープンループ伝達関数の共通因子で あるが、 $e^{j\psi}$ はオープンループ伝達関数の共通位 相因子にはなっていない。(B19)式からは、安定 条件即ち $|z_p|<1(p=1,2,...,M)$ を満たしてお り、かつ $\omega = 2\pi v/T_0$ の近傍で $|G_0(e^{j\omega T_0})| >> 1$ で あれば、F(z)の位相はクローズドループの応答 にはほとんど関係しないように見える。位相は安 定ゲインの符号に関係する程度であって、あまり 位相にとらわれる必要はないのではないか。直感 的には 4-3 節で述べたように、F(z)の位相は BPM の位置でのxとキッカー位置でのx'のベー タートロン位相差とするのが良いと思われるが、 このような位相が最適と断じて良いのであろう か?最適位相は(B19)式から自然に導かれるはず であるが、まだ証明できていない。この問題は筆 者の宿題として残っている。